**Сошников, Александр Игоревич. Методы измерения электрических свойств наноструктур с помощью полупроводникового алмазного зонда : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Сошников Александр Игоревич; [Место защиты: Моск. ин-т стали и сплавов].- Москва, 2011.- 115 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/917**